

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 5, 2009

Исследование покрытий TiC–C методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии <i>М. В. Кузнецов, С. В. Борисов, О. П. Шепатковский, Ю. Г. Векслер, В. Л. Кожевников</i>	3
Фрактальная структура кластеров золота, образованных при осаждении в вакууме на диэлектрические подложки <i>А. В. Белко, А. В. Никитин, Н. Д. Стрекаль, А. Е. Герман</i>	11
EXAFS- и XMCD-исследования корреляций атомов и магнитных моментов в разупорядоченных нанокристаллических системах Fe с <i>sp</i> -элементами (Al, Si, Sn) <i>Е. В. Воронина, Т. Миянага, Ш. Нагамацу, Т. Фуджикава, Л. В. Добышева</i>	16
Определение атомных парных корреляционных функций пленок оксида никеля EELFS-методом <i>О. Р. Бакиева, Д. Е. Гай, А. Н. Деев, Ф. З. Гильмутдинов</i>	25
Полуаналитическая теория фокусировки синхротронного излучения произвольной системой параболических преломляющих линз и проблема нанофокусировки <i>В. Г. Кон</i>	32
Электронная структура титаната стронция <i>В. В. Соболев, В. Вал. Соболев, Д. М. Ураков</i>	40
Пространственно-временной анализ рассеяния мессбауэровского излучения <i>Ф. С. Джепаров, Д. В. Львов, Е. В. Сильвачева</i>	47
Синтез и исследование структуры феррожидкостей с порфиринами и перспективы их применения в фотодинамической терапии <i>Ю. В. Кульвелис, В. А. Трунов, В. Т. Лебедев, Д. Н. Орлова, М. Л. Гельфонд</i>	55
Описание интегральной интенсивности брэгговских пиков в порошковых нейтронных дифрактометрах с учетом пространственных эффектов <i>В. И. Бобровский</i>	63
Малые кластеры меди: изучение локальной атомной и электронной структуры методами XANES и DFT <i>В. Л. Мазалова, Г. Э. Яловега, А. В. Солдатов</i>	70
Анализ XANES-спектров, измеренных с разрешением по времени, для определения структуры металлоорганических соединений в растворе <i>Г. Ю. Смоленцев, А. В. Солдатов</i>	74
Нелинейная модель термического пика в пиролитическом графите при облучении тяжелыми ионами ^{86}Kr и ^{209}Bi высокой энергии <i>И. В. Амирханов, А. Ю. Дидык, Д. З. Музафаров, И. В. Пузынин, Т. П. Пузынина, Н. Р. Саркар, И. Сархатов, З. А. Шарипов</i>	78
Исследование эпитаксиальных слоев 4H-SiC, имплантированных ионами Al <i>Е. В. Колесникова, Е. В. Калинина, А. А. Ситникова, М. В. Заморянская</i>	87
Композиционный состав и повреждение поверхности кремния при ионно-ассистированном нанесении тонких пленок <i>И. С. Ташлыков, О. Г. Бобрович, С. М. Барайшук, О. М. Михалкович, И. П. Антонович</i>	92
Особенности изменения спектров отражения покрытия Ф4МБ/Al при облучении ионами H^+ , H_2^+ , H_3^+ <i>М. М. Михайлов, В. В. Фризен</i>	96
Исследование эмиссии оже-электронов с поверхности кремния при бомбардировке пучком ионов и электронов <i>А. А. Алиев, А. А. Абдуваитов, М. К. Рузибаева</i>	102
Численный анализ массовой кристаллизации аморфных сплавов <i>В. Ф. Башев, А. М. Овруцкий, А. А. Рожко, А. С. Прохода</i>	106

